

# ウェハ上のアルミニウム電極用のUBM形成プロセス

Under Barrier Metal Formation Process for Al Electrode on Wafer

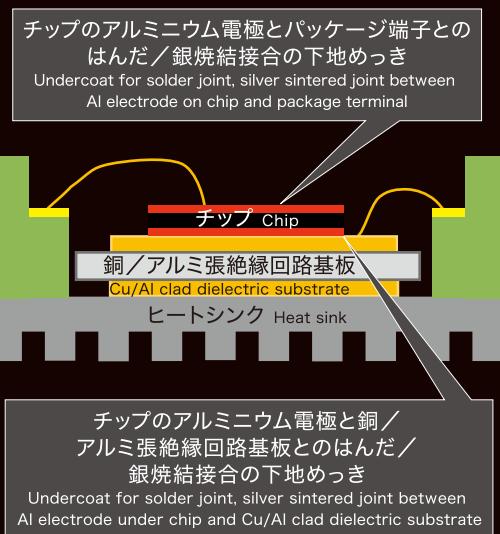
# TORYZA EL PROCESS

## ▶ 高温接合・高温常用に対応可能な無電解ニッケルめっき皮膜

Electroless nickel plating for high-temperature mounting and use

## ▶ 12インチウエハにも対応可能な全自動無電解めっき装置の導入・販売を開始

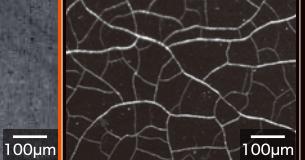
Okuno can sell automatic electroless plating equipment applicable to 12 inch wafer



**高温接合に対応可能な無電解ニッケルめっき皮膜**  
Electroless Ni plating film applicable to high temperature jointing

TORYZA NCR HRC

従来ニッケルめっき皮膜  
Conventional



熱処理: 400°C 30分  
Heat treatment, 400°C 30 min

エリクセン塗膜強度試験機による押し込み試験後の外観比較  
(ニッケル膜厚: 3μm 押し込み幅: 0.5mm)

400°Cの熱処理後でもクラックが発生しない  
Prevent cracks after 400°C heat treatment

## 12インチウエハ対応 全自動無電解めっき装置

Automatic electroless plating equipment  
Applicable to 12 inch wafer



装置全体像  
Overall picture

自動開閉蓋搭載  
Automatic open/close lid

- ・6, 8, 12インチサイズのウエハに対応  
Applicable to 6, 8, 12 inch wafer
- ・25枚フルキャリア 2列搬送対応  
25 pieces, full career, 2 lines
- ・クリーンルーム クラス1000対応  
Cleanroom Class 1000
- ・生産管理システム、生産監視自動録画システム搭載  
Equipped with automatic recording system for production management and production monitoring

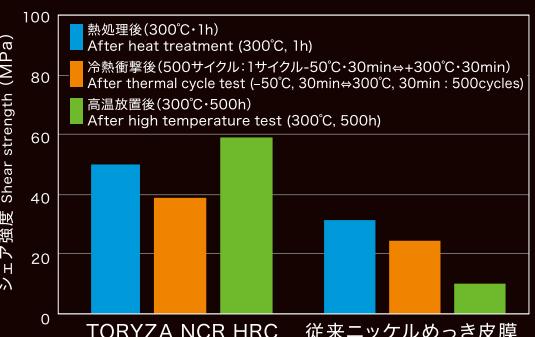
## 高温常用に対応可能な無電解ニッケルめっき皮膜

Electroless Ni plating film to endure high-temperature environment

### 冷熱衝撃、高温放置試験後の無電解ニッケルめっき皮膜のクラック発生

Crack occurrence comparison of electroless Ni plating film

| 無電解ニッケルめっき皮膜<br>Electroless Ni plating film | クラック発生 Crack occurrence      |                              |                                      |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|   | 熱処理後<br>After heat treatment | 冷熱衝撃後<br>After thermal cycle | 高温放置後<br>After high temperature test |
| TORYZA NCR HRC                              | なし<br>No                     | なし<br>No                     | なし<br>No                             |
| 従来ニッケルめっき皮膜<br>Conventional                 | なし<br>No                     | あり<br>Occur                  | あり<br>Occur                          |



大阪大学・産業科学研究所内 F3D実装協働研究所のご協力により実施

SICチップ: Ti Sputtering on SICチップにチタンスパッタ膜ー銀スパッタ膜を形成

接合条件: 無電解ニッケルめっき(膜厚: 7μm)したDBA基板上にSiCチップを銀ベーストを用いて焼結(1MPaで加圧、300°C・1h)

Presented by SANKEN, Osaka University Flexible 3D JISSO Collaborative Research Institute

SiC Chip: Ti sputtering on SiC chip, and form Ag sputtering layer

Joining condition: Electroless Ni plating (7μm thickness) on DBA substrate and sintering SiC chip

on DBA substrate with Ag paste Adding 1MPa pressure, 300°C, 1h